

Índice

1. Introducción	19
1.1. Presentación	19
1.2. Objetivos	22
1.3. Estructura de la Tesis	22
2. Caracterización Dieléctrica de Materiales	25
2.1. Conceptos y definiciones	25
2.2. Técnicas de Medida.....	31
2.2.1. Placas Paralelas	31
2.2.2. Sondas Coaxiales	32
2.2.3. Líneas de Transmisión	34
2.2.4. Espacio Libre	35
2.2.5. Resonadores	37
3. Métodos de Análisis Electromagnético	49
3.1. Métodos Analíticos	51

3.1.1. Método de Separación de Variables	51
3.1.2. Método Perturbacional	52
3.2. Métodos Modales	54
3.2.1. Método de Adaptación Modal (<i>mode-matching</i>)	54
3.2.2. Métodos Circuitales con Matrices Generalizadas	56
3.2.2.1. Matriz de Inmitancia Generalizada (GAM y GIM)	57
3.2.2.2. Matriz de Dispersión Generalizada (GSM)	59
3.2.2.3. Análisis Circuital Generalizado (GCA)	62
3.3. Métodos basados en operadores diferenciales.....	64
3.3.1. Método de Diferencias Finitas (FD y FDTD)	65
3.3.2. Método de Elementos Finitos (FEM)	66
3.4. Métodos basados en operadores integrales.....	68
3.4.1. Método de los Momentos (MoM)	69
3.4.2. Método de la Ecuación Integral de Frontera (BIE)	70
4. Análisis Circuital Generalizado de Onda Completa o <i>Full-Wave</i> - <i>Generalized Circuit Analysis Full Wave (GCAFW)</i>.....	73
4.1. Elementos básicos con puertos en superficie transversales.....	75
4.1.1. Elemento básico <i>Cyl2Cyl</i>	75
4.1.2. Elemento básico <i>Coax2Coax</i>	83
4.1.3. Elemento básico <i>Cyl2LittleCyl</i>	85
4.1.4. Elemento básico <i>Cyl2Ring</i>	92
4.1.5. Impedancia/Admitancia Característica en el puerto	93
4.2. Elementos básicos con puertos en superficies longitudinales	94
4.2.1. Elemento básico <i>Lat1</i>	94
4.2.2. Elemento básico <i>Lat2Lat</i>	99
4.2.3. Impedancia/Admitancia Característica en el puerto	104

4.3. Simulaciones y Validaciones	105
4.3.1. Verificación de Ajuste de las Funciones Base a los Campos Modales	105
4.3.2. Comparación de Parámetros Modales con Otros Métodos	111
4.3.3. Simulación de Cavidades Resonantes.....	112
4.3.3.1. Estructuras Analíticas	112
4.3.3.2. Cavity Circular con orificio.....	116
4.3.3.3. Cavity <i>Split</i>	118
4.3.3.4. Cavity Reentrante.....	120
4.4. Limitaciones del método	123
5. Hibridación del Análisis Modal y el Análisis Circuital Generalizado – Mode-Matching Circuital Full-Wave (MMCFW)	125
5.1. Motivación y Principio de Funcionamiento.....	125
5.2. Campos en el interior de estructuras cilíndricas multicapa.....	131
5.3. Funciones Base	138
5.4. Caracterización de los elementos básicos	141
5.4.1. Elemento Externo.....	141
5.4.2. Elemento Interno.....	145
5.4.2.1. Elemento Interno con Cortocircuito en pared interna.....	147
5.4.3. Elemento Intermedio.....	147
5.4.4. Dimensionamiento de las matrices de caracterización modal.....	150
5.5. Conexión entre elementos básicos	152
5.5.1. Cálculo de las amplitudes de los campos	156
5.6. Caracterización de las pérdidas debido a las paredes conductoras.....	156
5.6.1. Modos TM.....	158
5.6.2. Modos TE.....	161
5.6.3. Modos Cruzados	164

5.6.4. Cálculo de parámetros indirectos	166
5.6.4.1. <i>Tangente de Pérdidas Dieléctricas $\tan\delta$</i>	166
5.6.4.2. <i>Tangente de Pérdidas Magnéticas $\tan\delta_m$</i>	167
5.6.4.3. <i>Conductividad del metal σ</i>	168
5.7. Convergencia.....	169
5.7.1. Relación óptima de modos de los elementos básicos	170
5.7.2. Mínimo número de modos en cada elemento básico.....	172
5.7.3. Extrapolación asintótica para infinitos modos.....	172
5.8. Identificación y representación gráfica de modos resonantes	174
5.9. Simulaciones y Validaciones	181
5.9.1. Cavity Cargada Coaxialmente con 3 dieléctricos	182
5.9.2. Cavidades Cilíndrica y Coaxial Multicapa.....	183
5.9.3. Cavidades Cilíndricas Parcialmente Cargadas	184
5.9.3.1. <i>Dielectric Disk</i>	184
5.9.3.2. <i>Dielectric Ring</i>	187
5.9.3.3. <i>Sandwiched dielectric rod</i>	189
5.9.4. Cavidades Cilíndricas con orificio de inserción	190
5.9.5. Cavity <i>Split-Post Resonator</i>	192
5.9.6. Cavidades Reentrantes	194
5.10. Limitaciones	196
6. Aplicaciones Experimentales	199
6.1. Consideraciones en medidas experimentales	199
6.1.1. Medidas de frecuencia de resonancia y factor de calidad descargados	200
6.1.2. Cálculo de Incertidumbres en la medida	201
6.1.2.1. Incertidumbre directa	202
6.1.2.2. Incertidumbre indirecta	204

6.1.3. Procedimiento de medida de propiedades dieléctricas.....	205
6.2. Cálculo de propiedades dieléctricas utilizando todo tipo de modos en cavidades típicamente empleadas en dielectrometría	207
6.2.1. Cavidad <i>Split</i>	207
6.2.2. Cavidad Circular	209
6.2.3. Cavidad Circular con orificio para medida de <i>rods</i>	212
6.2.4. Cavidad Reentrante	213
6.3. Cavidades utilizadas en aplicaciones específicas de microondas.....	215
6.3.1. Cavidad circular orientada a calorimetría	216
6.3.2. Cavidad reentrante con orificio de inserción: equipo <i>dielectric kit (dielkit)</i> de viales	218
6.3.3. Cavidad bi-reentrante orientada a medida de líquidos con altas pérdidas...	222
7. Conclusiones y Líneas Futuras	227
7.1. Conclusiones	227
7.2. Líneas Futuras	229

Apéndices

I. Expansión en Series de Funciones Base.....	231
II. Campos en Guías de Sección Circular.....	237
III. Funciones de Bessel.....	245
III.A. Expresiones Asintóticas	246
III.B. Integrales.....	247
III.C. Consideraciones MATLAB	249
IV. Método Modificado de Chebyshev para Búsqueda de Raíces Complejas.....	251
V. Integrales trigonométricas, hiperbólicas y exponenciales	257

Índice

Software Implementado	271
Publicaciones	275
Referencias.....	277